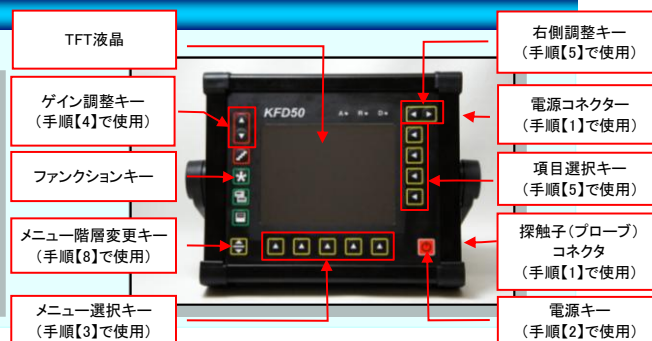
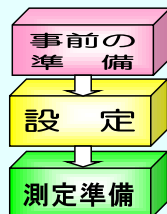


KFD50(垂直探傷)

製品案内 超音波探傷器 簡易取扱説明書 測定範囲の調整方法



概要



事前の準備

1



KFD50(上部電源コネクタ)とACアダプター、探触子コネクタと探触子(プローブ)をケーブルで接続する。

2



「電源」キーを押し電源を入れる。

KFD50(垂直探傷)

製品案内 超音波探傷器 簡易取扱説明書 測定範囲の調整方法



設定 (メニュー構成) ※測定前に確認してください

3

□ : 重要度: 高
□ : 重要度: 低

<メニュー: 第1階層>

基本		送信部		受信部		ゲート (a)		ゲート (b)	
測定範囲	125.0 mm	ダンピング	低	dBステップ	20.0 dB	ゲート評価	正	ゲート評価	オフ
音速	5900 m/s	送信出力	高	リジェクト	0%	a起点	30.00mm	b起点	80.00mm
ディレイ	0.00 uS	二探触子	オフ	受信周波数	2.0 - 20	a幅	20.00mm	b幅	50.00mm
0点調整	0.000 uS	AGC	80%	波形表示	全波	a高さ	10%	b高さ	10%

<メニュー: 第2階層>

校正		JDAC		斜角		保存		データ	
基準路程1	25.00 mm	区分線	H	屈折角	0.0	保存番号	1	探傷情報	オフ
基準路程2	50.00 mm	DAC	オフ	入射点	0.00 mm	呼出	オフ	情報表示	オフ
a起点	30.00mm	DACエコ	0	スキップ	0	保存	オフ	保存情報	オフ
校正	オフ	a起点	40.00mm	板厚	10.00mm	削除	オフ	設定一覧	オフ
		感度調整	0.0 dB	外径	平面	全削除	オフ		
		区分幅	6.0 dB						

<メニュー: 第3階層>

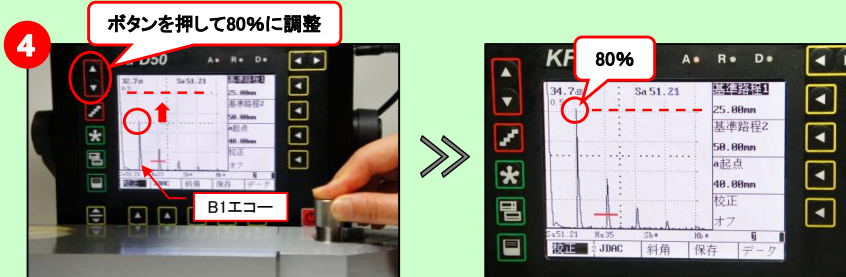
設定1		表示値		LCD		設定2		設定3	
ビーム路程	Jフランク	表示位置 1	Sa	強調表示	オフ	言語	日本語	評価モード	JISDAC
測定値表示	Sa	表示位置 2	Ha%	表示色	1	単位	mm	スクウェア	オフ
拡大ゲート	A	表示位置 3	Sb	ライト	0	ブザー	オフ		
ASコープ	MA表示	表示位置 4	Hb%	グリッド	0	日付			
				スケール	測定値	時間			

KFD50(垂直探傷)

製品案内 超音波探傷器 簡易取扱説明書 測定範囲の調整方法

4 測定準備(測定範囲の調整)

ゲインの調整



STB-A1(25mm部)に接触媒質(カプラント)を少量塗布し、探触子(プローブ)を接触させる。

左上の「8」キーを押しB1エコーを80%の高さに調整する。
校正メニューを表示させる。

校正



項目選択キーの「校正」キーを2回押す。

校正項目に「基準1?」と表示されている事を確認し、「<>」キーでゲートをB1エコーへ移動させる。



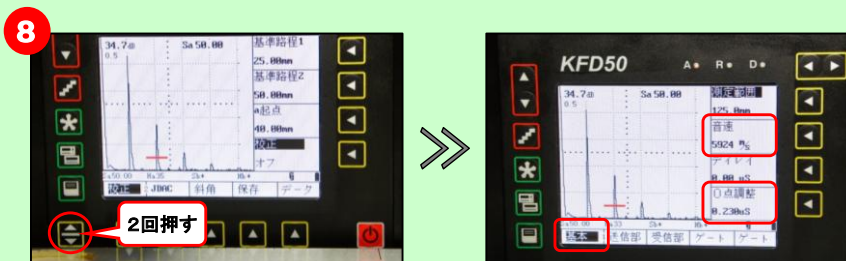
「校正」キーを2回押す。

校正項目に「基準2?」と表示されている事を確認し、「<>」キーでゲートをB2エコーへ移動させる。



「校正」キーを2回押す。

校正項目に「オフ」の文字が表示され、校正が完了する。



「メニュー階層変更」キーを2回押し、基本メニューへ切り替える。
実際の『音速』『0点調整』の値を確認する。